

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNISA996574994103316 |
| Titolo | 1500-2022 - IEEE Standard Testability Method for Embedded Core-based Integrated Circuits // IEEE |
| Pubbl/distr/stampa | New York : , : IEEE, , 2022 |
| ISBN | 1-5044-8866-0 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (168 pages) |
| Disciplina | 621.3815 |
| Soggetti | Integrated circuits - Testing Embedded computer systems - Testing Systems on a chip - Testing - Standards |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Sommario/riassunto | A mechanism for the test of core designs within a system on chip (SoC) is defined. This mechanism is a hardware architecture and the core test language (CTL) is leveraged to facilitate communication between core designers and core integrators. |

| | |
|-------------------------|---|
| 2. Record Nr. | UNICAMPANIAVAN0071517 |
| Autore | Rohde, Jan C. |
| Titolo | Cyclic coverings, Calabi-Yau manifolds and complex multiplication / Jan Christian Rohde |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2009 |
| Titolo uniforme | Cyclic coverings, Calabi-Yau manifolds and complex multiplication |
| ISBN | 978-36-420-0638-8 |
| Descrizione fisica | IX, 228 p. ; 24 cm |
| Soggetti | 14D07 - Variation of Hodge structures [MSC 2020] 14G35 - Modular and Shimura varieties [MSC 2020] 14J32 - Calabi-Yau manifolds (algebro-geometric aspects) [MSC 2020] |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Note generali | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |